



SUOMI—FINLAND

(Fi)

Patentti- ja rekisterihallitus  
Patent- och registerstyrelsen

# PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11)(21) Patenttihakemus-Patentansökan 880702  
(51) Kv.lk.<sup>4</sup>/Int.cl.<sup>4</sup> E 04 C 2/32, E 04 D 3/30  
(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 15.02.88  
(23) Alkupäivä-Löpdag  
(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 17.08.88  
(86) Kv. hakemus-Int.ansökan  
(30) Etuoikeus-Prioritet 16.02.87 SE 8700623-5

(71) Hakija/Sökande: *Plannja AB*, Luleå, Ruotsi

(72) Keksijä/Uppfinnare: Kero, Ernst

(74) Asiamies/Ombud: Forssen & Salomaa

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Profiloitu levy rakentamistarkoituksia varten. Profilerad skiva för byggningsändamål.

## (57) Tiivistelmä

Keksinnön kohteena on profiloitu levy (3) rakennustarkoituksiin, erityisesti katto- ja julkisivulevynä, joka sanottu levy käsittää normaalin profiloinnin ja lisäksi ainakin tietyissä osissa aallotetun mikroprofiloinnin (4), joka poikkeaa normaaliprofiloinnista. Mikroprofiloinnilla on harja-, laakso- ja/tai kylkiosissaan litistettyjä ja/tai sisäänpuristettuja alueita, mikä johtaa siihen, että profiloitun levyn paksuus vaihtelee mikroprofiloinnin pitkittäissuunnan poikkisuuntaan, joka on sama kuin normaaliprofiloinnin pitkittäissuunta. Litistetyt ja/tai sisäänpuristetut alueet etenevät mikroprofiloinnin pitkittäissuuntaan.

## (57) Sammandrag

Uppfinningen avser en profilerad skiva för byggnadsändamål, speciellt tak- och fasadskivor, varvid nämnda skiva innefattar en normal profilering och som dessutom, åtminstone vid vissa delar, en korrugerad mikroprofilering (4) som avviker från den normala profileringen. Mikroprofileringen uppvisar tillplattade och/eller inpressade områden vid dess ås-, dal- och/eller flankdelar som resulterar i att tjockleken av den profilerade skivan varierar i en riktning tvärsöver den längsgående riktningen av mikroprofileringen som överensstämmer med den längsgående riktningen av den normala profileringen. De inplattade och/eller inpressade områdena sträcker sig i den längsgående riktningen av mikroprofileringen.

